

---

---

# Auger Elektronenspectroscopy (AES)



Leibniz Institute  
for high  
performance  
microelectronics

## Technische Parameter

### Auger Electron Spectrometer:

Physical Electronics PHI 670 Nanoprobe

**Ionenquelle:** Ar<sup>+</sup> Ionen (Energie 1-5 keV)

**Primärstrahl:** fokussierter Elektronenstrahl  
(1 - 25 keV) – Feldemitter

**Detektiertes Signal:** Auger Elektronen,  
Sekundärelektronen

**Detektierte Elemente:** Li-U; Informationen  
über chemische Bindungen

**Lateralauflösung:** 100 nm

**Tiefenauflösung:** 2 – 3 nm (Tiefenprofile)

**Nachweisempfindlichkeit:** 0.1 - 1 at%



## Einsatzgebiete

- Oberflächenanalyse
- Multipunktanalyse
- Tiefenprofilanalyse von kleinen Strukturen
- Verunreinigungsanalyse
- Zusammensetzung dünner Schichten

## Ansprechpartner

Dr. Ioan Costina

Telefon: +49 335 5625 370

Fax: +49 335 5625 327

Email: [costina@ihp-  
microelectronics.com](mailto:costina@ihp-microelectronics.com)